### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-7801 (P2003-7801A)

(43)公開日 平成15年1月10日(2003.1.10)

(51) Int.Cl.7		識別記号	F I デーマコート*(参考)				
H01L	21/68		H01L 2	21/68		Α	4 K 0 3 0
B65G	49/00		B65G 4	49/00		С	5 F O 3 1
	49/07		4	49/07		L	5 F 0 4 5
C 2 3 C	16/44		C 2 3 C	16/44		F	
H01L	21/205		H01L 2	21/205			
		審査請求	未請求 請求功	頃の数1	OL	(全 11 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願2001-189380(P2001-189380)	(71) 出願人 000001122				
				株式会社			
(22)出願日		平成13年6月22日(2001.6.22)		東京都中	·野区)	東中野三丁目	14番20号
			(72)発明者	立野 秀	人		
				東京都中	野区」	東中野三丁目	14番20号 株式
				会社日立	国際的	電気内	
			(72)発明者	柳川秀	宏		
				東京都中	野区」	東中野三丁目	14番20号 株式
				会社日立	国際電	重気内	
			(74)代理人	10008563	37		
				弁理士	梶原	辰也	
				最終頁に続			

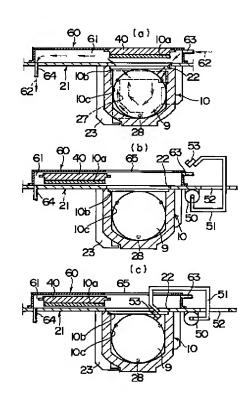
# (54) 【発明の名称】 基板処理装置

### (57)【要約】

【課題】 ポッドオープナによるポッドの開放時の弊害 の発生を防止する。

【解決手段】 ポッド10とボート8との間でウエハ9を授受するウエハ授受ポート13にはポッド10のドア10aを着脱してウエハ出し入れ口10bを開閉するポッドオープナ20が設備されており、ポッドオープナ20のベース21にはベース21のウエハ出し入れ口22を被覆するチャンバ60が設置され、チャンバ60にはクロージャ収容室61に窒素ガス62を流通させる給気管63、排気管64が接続されている。ポッドの開放時に窒素ガス62をチャンバ60のクロージャ収容室61に充填し、クロージャ収容室61、ポッド10のウエハ収納室10cの空気や水分を窒素ガス62によってパージする。

【効果】 ポッド内の大気のウエハ移載空間への放出を 防止できるため、移載空間の汚染や酸素濃度の上昇、ウ エハの酸化やパーティクル付着を防止できる。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数枚の基板が基板出し入れ口から収納されこの基板出し入れ口にはドアが着脱自在に装着されたキャリアを取り扱う基板処理装置であって、前記キャリアに対して前記基板を出し入れする基板授受ポートが設けられているとともに、この基板授受ポートには前記ドアを着脱して前記キャリアを開閉するキャリア開閉装置が設けられており、前記基板授受ポートには前記キャリアの前記基板出し入れ口を被覆するチャンバが設置され、このチャンバには前記キャリアの内部に前記基板出し入れ口から不活性ガスを導入させる給気管が接続されていることを特徴とする基板処理装置。

### 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、基板処理装置に関し、特に、ドアを有するキャリアを開閉する技術に係り、例えば、半導体素子を含む半導体集積回路を作り込まれる基板としての半導体ウエハ(以下、ウエハという。)に絶縁膜や金属膜等のCVD膜を形成したり不純物を拡散したりするバッチ式縦形拡散・CVD装置に利20用して有効なものに関する。

#### [0002]

【従来の技術】基板処理装置の一例であるバッチ式縦形拡散・CVD装置(以下、バッチ式CVD装置という。)においては、複数枚のウエハがキャリア(ウエハ収納容器)に収納された状態で扱われる。従来のこの種のキャリアとして、互いに対向する一対の面が開口された略立方体の箱形状に形成されているオープンカセットと、一つの面が開口された略立方体の箱形状に形成され開口面にドアが着脱自在に装着されているFOUP(fr 30 ont opening unified pod 。以下、ボッドという。)とがある。

【0003】ウエハのキャリアとしてポッドが使用され る場合には、ウエハが密閉された状態で搬送されること になるため、周囲の雰囲気にパーティクル等が存在して いたとしてもウエハの清浄度は維持することができる。 したがって、バッチ式CVD装置が設置されるクリーン ルーム内の清浄度をあまり高く設定する必要がなくなる ため、クリーンルームに要するコストを低減することが できる。そこで、最近のバッチ式CVD装置においては 40 ウエハのキャリアとしてポッドが使用されて来ている。 【0004】ウエハのキャリアとしてポッドを使用する バッチ式CVD装置においては、ドアを着脱してポッド のウエハ出し入れ口を開閉するポッド開閉装置(以下、 ポッドオープナという。)が、ポッドに対してウエハを 出し入れするためのウエハ授受ポートに設置されてい る。従来のこの種のポッドオープナはポッドを保持する 載置台と、載置台が保持したポッドのドアを保持するク ロージャとを備えており、クロージャがドアを保持した 状態で進退することにより、ドアをポッドのウエハ出し 50 2

入れ口に対して着脱するように構成されている。

#### [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来のバッチ式CVD装置においては、ポッドがポッドオープナによって開放されると、ポッドのウエハ収納室が大気雰囲気に晒される状態になるため、ウエハ収納室に収納されたウエハに自然酸化膜が堆積したりパーティクルが付着したりする場合がある。また、ポッドのウエハ収納室には不活性ガスが充填される場合もあるが、ポッドのウエハ収納室は大気雰囲気になっているのが通例である。大気雰囲気になっている場合には、ポッドが開放された際に、ポッドのウエハ収納室の大気がバッチ式CVD装置におけるウエハ授受ポートの内側空間に侵入してしまうため、内側空間を汚染したり酸素濃度を上昇させてしまうという問題点が発生する。

【0006】本発明の目的は、基板の自然酸化膜の堆積やパーティクルの付着、内側空間の汚染や酸素濃度の上昇等のポッドの開放時における弊害の発生を防止することができる基板処理装置を提供することにある。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】前記した課題を解決するための手段は、複数枚の基板が基板出し入れ口から収納されこの基板出し入れ口にはドアが着脱自在に装着されたキャリアを取り扱う基板処理装置であって、前記キャリアに対して前記基板を出し入れする基板授受ポートが設けられているとともに、この基板授受ポートには前記ドアを着脱して前記キャリアを開閉するキャリア開閉装置が設けられており、前記基板授受ポートには前記キャリアの前記基板出し入れ口を被覆するチャンバが設置され、このチャンバには前記キャリアの内部に前記基板出し入れ口から不活性ガスを導入させる給気管が接続されていることを特徴とする。

【0008】前記した手段によれば、ドアが外されてキャリアの基板出し入れ口が開放された際に、チャンバに不活性ガスを供給することにより、不活性ガスをキャリアの内部に基板出し入れ口から流通させて不活性ガスによってパージすることができるため、基板の自然酸化膜の堆積やパーティクルの付着、内側空間の汚染や酸素濃度の上昇等のポッドの開放時における弊害の発生を防止することができる。

#### [0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態を図面に即して説明する。

【0010】本実施の形態において、本発明に係る基板 処理装置は、バッチ式CVD装置すなわちバッチ式縦形 拡散・CVD装置として図1に示されているように構成 されている。図1に示されているバッチ式CVD装置1 は気密室構造に構築された筐体2を備えている。筐体2 内の一端部(以下、後端部とする。)の上部にはヒータ ユニット3が垂直方向に据え付けられており、ヒータユ ニット3の内部にはプロセスチューブ4が同心に配置されている。プロセスチューブ4にはプロセスチューブ4内に原料ガスやパージガス等を導入するためのガス導入管5と、プロセスチューブ4内を真空排気するための排気管6とが接続されている。筐体2の後端部の下部にはボートエレベータ7が設置されており、ボートエレベータ7はプロセスチューブ4の真下に配置されたボート8を垂直方向に昇降させるように構成されている。ボート8は多数枚のウエハ9を中心を揃えて水平に配置した状態で支持して、プロセスチューブ4の処理室に対して搬10入搬出するように構成されている。

【0011】筐体2の正面壁にはポッド出し入れ口(図示せず)が開設されており、ポッド出し入れ口はフロントシャッタによって開閉されるようになっている。ポッド出し入れ口にはポッド10の位置合わせを実行するポッドステージ11が設置されており、ポッド10はポッド出し入れ口を通してポッドステージ11に出し入れされるようになっている。

【0012】筐体2内の前後方向の中央部の上部には回転式のポッド棚12が設置されており、回転式のポッド 20棚12は合計十六個のポッド10を保管するように構成されている。すなわち、回転式のポッド棚12は略卍形状に形成された四段の棚板が上下方向に配置されて水平面内で回転自在に支承されており、モータ等の間欠回転駆動装置(図示せず)によってピッチ送り的に一方向に回転されるようになっている。筐体2内のポッド棚12の下側には基板としてのウエハ9をポッド10に対して授受するためのウエハ授受ポート13が一対、垂直方向に上下二段に配置されて設置されており、両ウエハ授受ポート13、13には後記するポッドオープナ20がそ30れぞれ設置されている。

【0013】筐体2内のポッドステージ11とポッド棚12およびウエハ授受ポート13との間にはポッド搬送装置14が設置されており、ポッド搬送装置14はポッドステージ11とポッド棚12およびウエハ授受ポート13との間およびポッド棚12とウエハ授受ポート13との間でポッド10を搬送するように構成されている。また、ウエハ授受ポート13とボート8との間にはウエハ移載装置15が設置されており、ウエハ移載装置15はウエハ授受ポート13とボート8との間でウエハ9を搬送するように構成されている。さらに、ボートエレベータ7の脇にはボートチェンジャ16が設置されており、ボートチェンジャ16は二台のボート8、8をボートエレベータ7に対して入れ替えるように構成されている。

【0014】上下のウエハ授受ポート13、13に設置されたポッドオープナ20、20は同一に構成されているため、ポッドオープナ20の構成については上段のウエハ授受ポート13に設置されたものについて説明する。

4

【0015】図1に示されているように、キャリア開閉 装置としてのポッドオープナ20は筐体2内においてウエハ授受ポート13とウエハ移載装置15とを仕切るように垂直に立脚された側壁をなすベース21を備えており、図2および図3に示されているように、ベース21にはポッド10のドア10aに対して若干大きめに相似する四角形に形成されたウエハ出し入れ口22が開設されている。ちなみに、ベース21は上下のポッドオープナ20、20で共用されているため、ベース21には上下で一対のウエハ出し入れ口22、22が垂直方向で縦に並ぶように開設されている。

【0016】図2に示されているように、ベース21のウエハ授受ポート13側の主面(以下、正面とする。)におけるウエハ出し入れ口22の下側には、アングル形状の支持台23が水平に固定されており、支持台23の平面視の形状は一部が切り欠かれた略正方形の枠形状に形成されている。支持台23の上面には一対のガイドレール24、24がベース21の正面と平行方向(以下、左右方向とする。)に配置されて、ベース21の正面と直角方向(以下、前後方向とする。)に延在するように敷設されており、左右のガイドレール24、24には載置台27が複数個のガイドブロック25を介して前後方向に摺動自在に支承されている。載置台27は支持台23の上面に据え付けられたエアシリング装置26によって前後方向に往復移動されるようになっている。

【0017】図2に示されているように、載置台27は一部が切り欠かれた略正方形の枠形状に形成されており、載置台27の上面には位置決めピン28が三本、正三角形の頂点に配置されて垂直に突設されている。三本の位置決めピン28はポッド10が図3に示されているように載置台27の上に載置された状態において、ポッド10の下面に没設された三箇所の位置決め凹部(図示せず)に嵌入するようになっている。

【0018】図4に示されているように、ベース21の ウエハ移載装置15側の主面(以下、背面とする。)に おけるウエハ出し入れ口22の下側には、ガイドレール 30が左右方向に水平に敷設されており、ガイドレール 30にはアングル形状に形成された左右方向移動台31 が左右方向に往復移動し得るように摺動自在に支承され ている。左右方向移動台31の垂直部材にはエアシリン ダ装置32が左右方向に水平に据え付けられており、エ アシリンダ装置32のピストンロッド32aの先端はベ ース21に固定されている。すなわち、左右方向移動台 31はエアシリング装置32の往復作動によって左右方 向に往復駆動されるようになっている。

【0019】図5に示されているように、左右方向移動 台31の水平部材の上面には一対のガイドレール33、 33が左右に配されて前後方向に延在するように敷設さ れており、両ガイドレール33、33には前後方向移動 50 台34が前後方向に往復移動し得るように摺動自在に支 5

承されている。前後方向移動台34の片側端部にはガイ ド孔35が左右方向に延在するように開設されている。 左右方向移動台31の一側面にはブラケット36が固定 されており、ブラケット36にはロータリーアクチュエ ータ37が垂直方向上向きに据え付けられている。ロー タリーアクチュエータ37のアーム37aの先端に垂直 に立脚されたガイドピン38は前後方向移動台34のガ イド孔35に摺動自在に嵌入されている。すなわち、前 後方向移動台34はロータリーアクチュエータ37の往 復回動によって前後方向に往復駆動されるように構成さ 10 れている。

【0020】前後方向移動台34の上面にはブラケット 39が垂直に立脚されており、ブラケット39の正面に はウエハ出し入れ口22に若干大きめに相似する長方形 の平盤形状に形成されたクロージャ40が垂直に固定さ れている。つまり、クロージャ40は前後方向移動台3 4によって前後方向に往復移動されるようになっている とともに、左右方向移動台31によって左右方向に往復 移動されるようになっている。そして、クロージャ40 は前進移動してそのベース側を向いた主面(以下、正面 20 とする。)がベース21の背面に当接することによりウ エハ出し入れ口22を閉塞し得るようになっている。

【0021】なお、図5に示されているように、ベース 21の正面におけるウエハ出し入れ口22の周りには、 ポッド10の押し付け時にポッド10のウエハ出し入れ 口およびベース21のウエハ出し入れ口22をシールす るパッキン54が敷設されている。クロージャ40の正 面における外周縁近傍には、クロージャ40の押し付け 時にベース21のウエハ出し入れ口22をシールするた めのパッキン55が敷設されている。クロージャ40の 30 正面における外周縁のパッキン55の内側には、ドア1 0aに付着した異物がウエハ移載装置15の設置室側へ 侵入するのを防止するためのパッキン56が敷設されて いる。便宜上、図4および図5においては、後記するチ ャンバの図示が省略されている。

【0022】図4に示されているように、クロージャ4 0の上下方向の中心線上には一対の解錠軸41、41が 左右に配置されて前後方向に挿通されて回転自在に支承 されている。両解錠軸41、41におけるクロージャ4 0のベースと反対側の主面(以下、背面とする。)側の 40 端部には一対のプーリー42、42が固定されており、 両プーリー42、42間には連結片44を有するベルト 43が巻き掛けられている。クロージャ40の背面にお ける一方のプーリー42の上側にはエアシリンダ装置4 5が水平に据え付けられており、エアシリンダ装置45 のピストンロッドの先端はベルト43の連結片44に連 結されている。すなわち、両解錠軸41、41はエアシ リンダ装置45の伸縮作動によって往復回動されるよう になっている。図2に示されているように、両解錠軸4

aの錠前(図示せず)に係合する係合部41aが直交し て突設されている。

6

【0023】図2に示されているように、クロージャ4 0の正面における一方の対角付近にはドア10aの表面 に吸着する吸着具(吸盤)46が二個、吸込口部材47 によってそれぞれ固定されている。吸着具46を固定す る吸込口部材47は中空軸によって構成されており、吸 込口部材47の背面側端は給排気路(図示せず)に接続 されている。吸込口部材47の正面側端の外径はドア1 Oaに没設された位置決め穴(図示せず)に嵌入するよ うに設定されている。すなわち、吸込口部材47はドア 10 aの位置決め穴に嵌入してドア10 aを機械的に支 持するための支持ピンを兼用するように構成されてい る。

【0024】図2、図4および図6に示されているよう に、ベース21の正面におけるウエハ出し入れ口22の 片脇にはロータリーアクチュエータ50が回転軸50a が垂直方向になるように据え付けられており、回転軸5 Oaには略C字形状に形成されたアーム51の一端が水 平面内で一体回動するように固定されている。アーム5 1はベース21に開設された挿通孔52を挿通されてお り、アーム51のベース21の背面側の先端部にはマッ ピング装置53が固定されている。

【0025】図6および図7に示されているように、べ ース21の背面にはチャンバ60が上下のポッドオープ ナ20、20のクロージャ40、40を収容するように 敷設されており、チャンバ60のクロージャ収容室61 の水平方向の長さはクロージャ40が横に移動してウエ ハ出し入れ口22を完全に開口させるのを許容し得るよ うに設定されている。チャンバ60の背面側の側壁の一 部には不活性ガスとしての窒素ガス62をクロージャ収 容室61に供給する給気管63がクロージャ収容室61 に連通するように接続されており、チャンバ60の正面 壁を形成するベース21の一部にはクロージャ収容室6 1に供給された窒素ガス62を排気する排気管64がク ロージャ収容室61に連通するように接続されている。 チャンバ60の背面壁における上下のウエハ出し入れ口 22、22に対向する位置には、チャンバ60のウエハ 出し入れ口65、65がそれぞれ開設されており、各ウ エハ出し入れ口65はクロージャ40の背面部を挿入し 得る大きさの四角形の開口に形成されている。また、ウ エハ出し入れ口65はマッピング装置53を背面側から 挿入し得るように設定されている。

【0026】次に、前記構成に係るバッチ式CVD装置 の作用を説明する。なお、説明を理解し易くするため、 以下の説明においては、一方のウエハ授受ポート13を 上段ポートAとし、他方のウエハ授受ポート13を下段 ポートBとする。

【0027】図1に示されているように、筐体2内のポ 1、41のクロージャ40の正面側の端部にはドア10 50 ッドステージ11にポッド出し入れ口から搬入されたポ

ッド10は、ポッド搬送装置14によって指定されたポ ッド棚12に適宜に搬送されて一時的に保管される。ポ ッド棚12に保管されたポッド10はポッド搬送装置1 4によって適宜にピックアップされ、上段ポートAに搬 送されて、ポッドオープナ20の載置台27に図3に示 されているように移載される。この際、ポッド10の下 面に没設された位置決め凹部が載置台27の三本の位置 決めピン28とそれぞれ嵌合されることにより、ポッド 10と載置台27との位置合わせが実行される。

【0028】ポッド10が載置台27に載置されて位置 10 合わせされると、載置台27がエアシリンダ装置26に よってベース21の方向に押され、図8(a)に示され ているように、ポッド10の開口側端面がベース21の 正面におけるウエハ出し入れ口22の開口縁辺部に押し 付けられる。また、ポッド10がベース21の方向に押 されると、クロージャ40の解錠軸41がドア10aの 鍵穴に挿入される。続いて、負圧がクロージャ40の吸 込口部材47に給排気路から供給されることにより、ポ ッド10のドア10aが吸着具46によって真空吸着保 持される。この状態で、解錠軸41がエアシリンダ装置 20 45によって回動されると、解錠軸41はドア10a側 の錠前に係合した係合部41aによってドア10aの錠 前の施錠を解除する。

【0029】次いで、前後方向移動台34がロータリー アクチュエータ37の作動によってベース21から離れ る方向に移動されると、図8(b)に示されているよう に、クロージャ40はポッド10のドア10aを真空吸 着保持した状態でチャンバ60のクロージャ収容室61 に後退することにより、ドア10aをポッド10のウエ ハ出し入れ口10bから抜き出す。これにより、ポッド 10のウエハ出し入れ口10bは開放された状態にな

【0030】クロージャ40が前後方向移動台34によ ってさらに後退されると、図8(c)に示されているよ うに、クロージャ40はチャンバ60の背面壁に開設さ れたウエハ出し入れ口65にクロージャ収容室61の内 側から挿入することにより、クロージャ収容室61を密 封した状態になる。

【0031】クロージャ40がクロージャ収容室61を 密封すると、図9(a)に示されているように、クロー 40 ジャ収容室61には窒素ガス62が給気管63と排気管 64とによって流通される。クロージャ収容室61を流 通する窒素ガス62はウエハ出し入れ口10bからポッ ド10のウエハ収納室10cに流入した後に流出するこ とにより、ウエハ収納室10cの大気を排気するととも にウエハ収納室10cに充満する。すなわち、チャンバ 60のクロージャ収容室61およびポッド10のウエハ 収納室10 c における大気中の空気や水分は窒素ガス6 2によってパージされた状態になる。

びポッド10のウエハ収納室10cが窒素ガス62によ ってパージされると、左右方向移動台31がエアシリン ダ装置32の作動によってウエハ出し入れ口22から離 れる方向に移動される。これにより、図9(b)に示さ れているように、ドア10aを吸着具46によって真空 吸着保持したクロージャ40はクロージャ収容室61を ベース21のウエハ出し入れ口22から離間した退避位 置に移動される。このクロージャ40の退避移動によ り、チャンバ60のウエハ出し入れ口65、ベース21 のウエハ出し入れ口22およびポッド10のウエハ出し 入れ口10bがそれぞれ開放された状態になる。この 際、予め、チャンバ60のクロージャ収容室61および ポッド10のウエハ収納室10cが窒素ガス62によっ てパージされているため、大気中の空気や水分がベース 21の背面側空間であるウエハ移載装置15の設置空間 に放出されることはなく、それらによるウエハ移載装置 15の移載空間の汚染や酸素濃度の上昇等の弊害の発生

は防止されることになる。

8

【0033】クロージャ40が退避されると、図9 (c) に示されているように、マッピング装置53がロ ータリーアクチュエータ50の作動によって移動され て、マッピング装置53がポッド10のウエハ収納室1 0 c ヘチャンバ6 0 のウエハ出し入れ口65、ベース2 1のウエハ出し入れ口22およびポッド10のウエハ出 し入れ口10bを潜り抜けて挿入される。ポッド10の ウエハ収納室10cへ挿入されたマッピング装置53は ウエハ収納室10cに収納された複数枚のウエハ9を検 出することによってマッピングする。ここで、マッピン グとはポッド10の中のウエハ9の所在位置(ウエハ9 がどの保持溝にあるのか。)を確認することである。指 定されたマッピング作業が終了すると、マッピング装置 53はロータリーアクチュエータ50の作動によって元 の待機位置に戻される。この際、予め、チャンバ60の クロージャ収容室61およびポッド10のウエハ収納室 10cが窒素ガス62によってパージされているため、 ウエハ収納室10cのウエハ9が大気中の空気や水分に 接触することはなく、それらによるウエハ9の自然酸化 膜の堆積やパーティクルの付着等の弊害の発生は防止さ れることになる。

【0034】マッピング装置53が待機位置に戻ると、 上段ポートAにおいて開けられたポッド10の複数枚の ウエハ9はボート8にウエハ移載装置15によって順次 装填(チャージング)されて行く。この際、ウエハ移載 装置15の移載空間の汚染や酸素濃度の上昇等の弊害の 発生は防止されているため、移載中のウエハ9の自然酸 化膜の堆積やパーティクルの付着等の弊害の発生は防止 されることになる。

【0035】この上段ポートAにおけるウエハ移載装置 15によるウエハ9のボート8への装填作業中に、下段 【0032】チャンバ60のクロージャ収容室61およ 50 ポートBにはポッド棚12から別のポッド10がポッド

10

搬送装置14によって搬送されて移載され、ポッドオー プナ20による前述した位置決め作業からマッピング作 業が同時進行される。このように下段ポートBにおいて マッピング作業迄が同時進行されていると、上段ポート Aにおけるウエハ9のボート8への装填作業の終了と同 時に、下段ポートBに待機させたポッド10についての ウエハ移載装置15によるウエハ9のボート8への装填 作業を開始することができる。すなわち、ウエハ移載装 置15はポッド10の入替え作業についての待ち時間を 浪費することなくウエハ移載作業を連続して実施するこ とができるため、バッチ式CVD装置1のスループット を高めることができる。

【0036】翻って、上段ポートAにおいてウエハ移載 装置15によるウエハ9のボート8への装填作業が終了 すると、空ポッド閉じ作業が前述したポッド開放作業と 略逆の順序で実行される。すなわち、クロージャ40に 保持されて退避されていたドア10aがウエハ出し入れ 口22の位置に左右方向移動台31によって戻され、前 後方向移動台34によってウエハ出し入れ口22に挿入 されてポッド10のウエハ出し入れ口10bに嵌入され 20 る。ドア10aがウエハ出し入れ口10bに嵌入される と、解錠軸41がエアシリンダ装置45によって回動さ れ、ドア10aの錠前を施錠する。ドア10aの施錠が 終了すると、給排気路から吸込口部材47へ供給されて いた負圧が切られて大気に開放されることにより、吸着 具46の真空吸着保持が解除される。続いて、載置台2 7がエアシリンダ装置26によってベース21から離れ る方向に移動され、ポッド10の開口側端面がベース2 1の正面から離座される。

【0037】ドア10aによりウエハ出し入れ口10b が閉塞された上段ポートAの空のポッド10は、ポッド 棚12にポッド搬送装置14によって搬送されて一時的 に戻される。空のポッド10が上段ポートAから搬出さ れると、次の実ポッド10が上段ポートAに搬入され る。以降、上段ポートAおよび下段ポートBにおいて、 前述した作業が必要回数繰り返される。

【0038】以上のようにして上段ポートAと下段ポー トBとに対するウエハ移載装置15によるウエハ9のボ ート8への装填作業が交互に繰り返されることによっ て、複数枚のウエハ9がポッド10からボート8に装填 40 されて行く。この際、バッチ処理するウエハ9の枚数 (例えば、百枚~百五十枚)は一台のポッド10に収納 されたウエハ9の枚数(例えば、二十五枚)よりも何倍 も多いため、複数台のポッド10が上段ポートAと下段 ポートBとにポッド搬送装置14によって交互に繰り返 し供給されることになる。

【0039】予め指定された複数枚のウエハ9がポッド 10からボート8に移載されると、ウエハ授受ポート1 3にとっては実質的に待機中となる成膜処理がプロセス チューブ4において実行される。すなわち、ボート8は 50 れ口から筐体2の外部に搬出されて、洗浄工程や成膜検

ボートエレベータ7によって上昇されてプロセスチュー ブ4の処理室に搬入される。ボート8が上限に達する と、ボート8を保持したシールキャップの上面の周辺部 がプロセスチューブ4をシール状態に閉塞するため、処 理室は気密に閉じられた状態になる。プロセスチューブ 4の処理室が気密に閉じられた状態で、所定の真空度に 排気管6によって真空排気され、ヒータユニット3によ って所定の温度に加熱され、所定の原料ガスがガス導入 管5によって所定の流量だけ供給される。これにより、 所定の膜がウエハ9に形成される。そして、予め設定さ れた処理時間が経過すると、ボート8がボートエレベー タ7によって下降されることにより、処理済みウエハ9 を保持したボート8が元の装填および脱装ステーション (以下、装填ステーションという。) に搬出される。 【0040】以上の成膜処理の実行中に上段ポートAお よび下段ポートBにおいては、他方のボート8に保持さ

れた処理済みウエハ9の脱装(ディスチャージング)作 業が同時進行されている。すなわち、装填ステーション に搬出されたボート8の処理済みウエハ9はウエハ移載 装置15によってピックアップされ、上段ポートAに予 め搬入されてドア10aを外されて開放された空のポッ ド10に収納される。上段ポートAでの空のポッド10 への所定の枚数のウエハ9の収容が終了すると、クロー ジャ40に保持されて退避されていたドア10aがウエ ハ出し入れ口22の位置に左右方向移動台31によって 戻され、前後方向移動台34によってウエハ出し入れ口 22に挿入されポッド10のウエハ出し入れ口10bに 嵌入される。この際にも、窒素ガス62がクロージャ収 容室61に給気管63と排気管64とによって流通され ることにより、クロージャ室61およびポッド10のウ エハ収納室10cが窒素ガス62によってパージされ、 ポッド収納室10cに窒素ガス62が充填される。ドア 10 aがウエハ出し入れ口10 bに嵌入されると、解錠 軸41がエアシリンダ装置45によって回動され、ドア 10aの錠前を施錠する。これにより、ウエハ収納室1 Ocには窒素ガス62が密封された状態になる。ドア1 O a の施錠が終了すると、給排気路から吸込口部材47 に供給されていた負圧が切られて大気に開放されること により、吸着具46のドア10aの真空吸着保持が解除 される。続いて、載置台27がエアシリンダ装置26に よってベース21から離れる方向に移動され、ポッド1 〇の開口側端面がベース21の正面から離座される。次 いで、処理済みのウエハ9が収納された処理済み実ポッ ド10はポッド棚12にポッド搬送装置14によって搬 送されて戻される。

【0041】処理済みウエハ9を収納してポッド棚12 に戻されたポッド10はポッド棚12からポッドステー ジ11へポッド搬送装置14によって搬送される。 ポッ ドステージ11に移載されたポッド10はポッド出し入 査工程等の次工程へ搬送される。そして、新規のウエハ 9を収納したポッド10が筐体2内のポッドステージ1 1にポッド出し入れ口から搬入される。

【0042】なお、新旧ポッド10のポッドステージ1 1への搬入搬出(ポッドローディングおよびポッドアン ローディング)作業およびポッドステージ11とポッド 棚12との間の入替え作業は、プロセスチューブ4にお けるボート8の搬入搬出(ボートローディングおよびボ ートアンローディング)作業や成膜処理の間すなわち成 膜待機ステップSt(Sp)の実行中に同時進行される 10 ため、バッチ式CVD装置1の全体としての作業時間が 延長されるのを防止することができる。

【0043】以降、以上説明したウエハ装填脱装方法お よび成膜方法が繰り返されて、CVD膜がウエハ9にバ ッチ式CVD装置1によって形成され、半導体素子を含 む集積回路がウエハ9に作り込まれる半導体装置の製造 方法における成膜工程が実施されて行く。

【0044】前記実施の形態によれば、次の効果が得ら れる。

【0045】1) ポッドオープナ20のベース21にポ 20 ッド10のウエハ出し入れ口10bを被覆するチャンバ 60を敷設し、このチャンバ60には窒素ガス62をク ロージャ収容室61に流通させるための給気管63およ び排気管64を接続することにより、ポッドオープナ2 0によるポッド10の開放時に窒素ガス62をチャンバ 60のクロージャ収納室61に充填することができるた め、ポッド10のウエハ収納室10cに閉じ込められて いた大気を窒素ガス62によって排気するとともに、ク ロージャ収容室61およびポッド10のウエハ収納室1 0 c における大気中の空気や水分を窒素ガス62によっ てパージすることができる。

【0046】2) チャンバ60のクロージャ収容室61 やポッド10のウエハ収納室10cを窒素ガス62によ ってパージすることにより、ポッド10のウエハ収納室 10cに閉じ込められていた大気中の空気や水分がベー ス21の背面側空間であるウエハ移載装置15の設置空 間に放出されるのを防止することができるため、それら によるウエハ移載装置15の移載空間の汚染や酸素濃度 の上昇等の弊害の発生は防止することができる。

【0047】3) また、ポッド10のウエハ出し入れ口 106の開放時にウエハ収納室10cのウエハ9が大気 中の空気や水分に接触するのを防止することができるた め、それらによるウエハ9の自然酸化膜の堆積やパーテ ィクルの付着等の弊害の発生を防止することができる。 さらに、ポッド10のウエハ出し入れ口10bの閉鎖時 に、ポッド10のウエハ収納室10cに窒素ガス62を 充填して密封することにより、収納中のウエハの自然酸 化等を抑制することができる。

【0048】4) チャンバ60の背面壁のウエハ出し入 れ口65をクロージャ40によって密封することができ 50 窒素ガスパージ時を示し、(b)はドアの退避時を示

12

るように構成することにより、窒素ガス62のクロージ ャ収容室61への充填時にウエハ出し入れ口65をクロ ージャ40によって密封することができるため、クロー ジャ収容室61およびポッド10のウエハ収納室10c を窒素ガス62によって効率的にパージすることができ る。

【0049】なお、本発明は前記実施の形態に限定され るものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々に変 更が可能であることはいうまでもない。

【0050】例えば、ウエハ授受ポートは上下二段設置 するに限らず、一段だけ設置してもよいし、上中下三段 のように三段以上設置してもよい。

【0051】マッピング装置をポッドに対して進退させ る構造としてはロータリーアクチュエータを使用した構 成を採用するに限らず、XY軸ロボット等を使用した構 成を採用してもよい。また、マッピング装置は省略して もよい。

【0052】 基板はウエハに限らず、ホトマスクやプリ ント配線基板、液晶パネル、コンパクトディスクおよび 磁気ディスク等であってもよい。

【0053】バッチ式CVD装置は成膜処理に使用する CVD装置に限らず、酸化膜形成処理や拡散処理等の熱 処理にも使用することができる。

【0054】前記実施の形態ではバッチ式縦形拡散・C VD装置の場合について説明したが、本発明はこれに限 らず、バッチ式CVD装置全般に適用することができ

#### [0055]

30

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 基板の自然酸化膜の堆積やパーティクルの付着、内側空 間の汚染や酸素濃度の上昇等のポッドの開放時における 弊害の発生を防止することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態であるバッチ式CVD装 置を示す一部省略斜視図である。

【図2】ポッドオープナを示す正面側から見た斜視図で ある。

【図3】そのポッド載置状態を示す斜視図である。

【図4】 ポッドオープナを示す背面側から見たチャンバ を取り除いた一部省略斜視図である。

【図5】図4の省略したV部を示す斜視図である。

【図6】 ポッドオープナを示す背面側から見たチャンバ を敷設した斜視図である。

【図7】その一部省略平面断面図である。

【図8】 ポッドオープナのその作用を説明するための各 一部省略平面断面図であり、(a)はドアの取外し前を 示し、(b)はドアの取外し後を示し、(c)はチャン バの密封時を示している。

【図9】同じく各一部省略平面断面図であり、(a)は

し、(c)はマッピング時を示している。

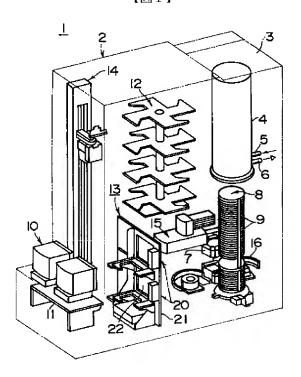
# 【符号の説明】

1…バッチ式CVD装置(基板処理装置)、2…筐体、 3…ヒータユニット、4…プロセスチューブ、5…ガス 導入管、6…排気管、7…ボートエレベータ、8…ボー ト、9…ウエハ(基板)、10…ポッド、10a…ド ア、106…ウエハ出し入れ口、10c…ウエハ収納 室、11…ポッドステージ、12…ポッド棚、13…ウ エハ授受ポート、14…ポッド搬送装置、15…ウエハ 移載装置、16…ボートチェンジャ、20…ポッドオー 10 3…マッピング装置、54、55、56…パッキン、6 プナ(開閉装置)、21…ベース、22…ウエハ出し入 れ口、23…支持台、24…ガイドレール、25…ガイ ドブロック、26…エアシリンダ装置、27…載置台、 28…位置決めピン、30…ガイドレール、31…左右

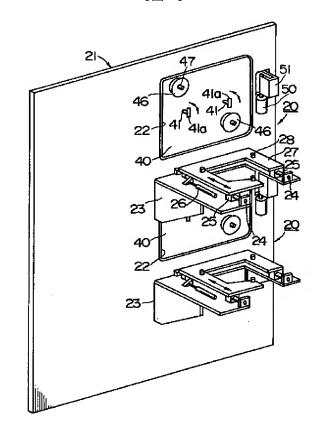
1 4

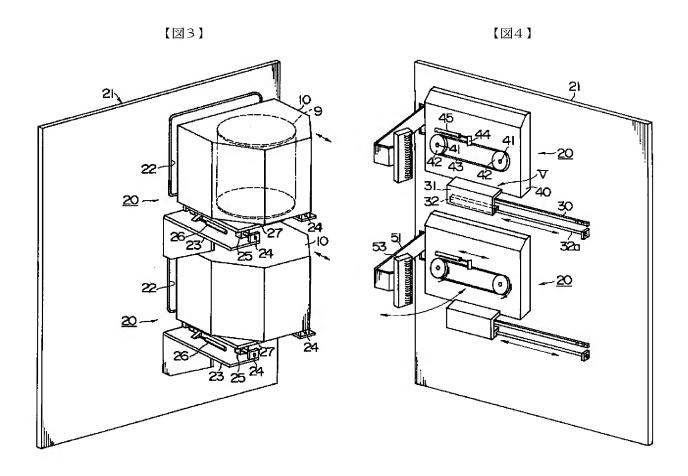
方向移動台、32…エアシリンダ装置、32a…ピスト ンロッド、33…ガイドレール、34…前後方向移動 台、35…ガイド孔、36…ブラケット、37…ロータ リーアクチュエータ、37a…アーム、38…ガイドピ ン、39…ブラケット、40…クロージャ、41…解錠 軸、41 a…係合部、42…プーリー、43…ベルト、 44…連結片、45…エアシリンダ装置、46…吸着 具、47…吸込口部材、50…ロータリーアクチュエー タ、50a…回転軸、51…アーム、52…挿通孔、5 0…チャンバ、61…クロージャ収容室、62…窒素ガ ス(不活性ガス)、63…給気管、64…排気管、65 …ウエハ出し入れ口。

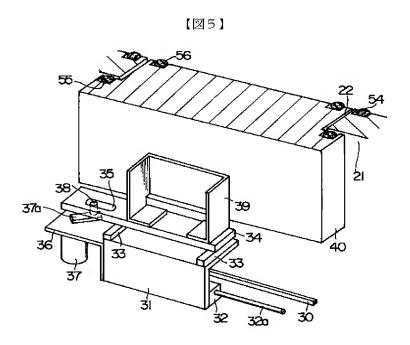
【図1】



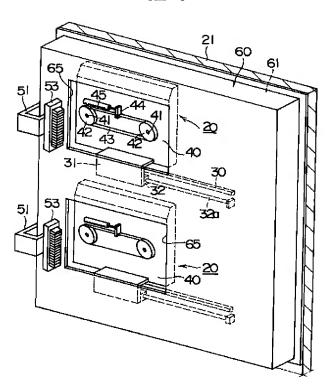
【図2】



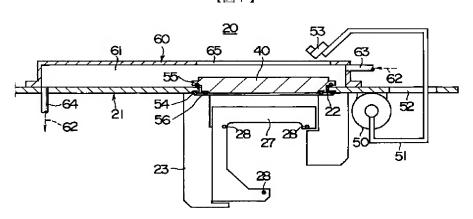


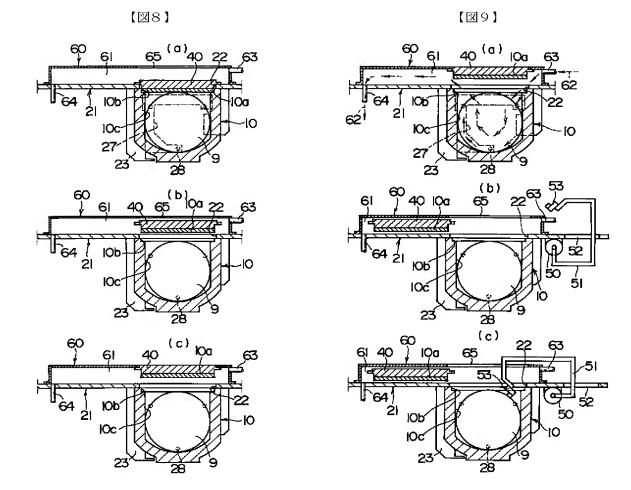


【図6】









フロントページの続き

Fターム(参考) 4K030 CA04 CA12 GA12 LA15 5F031 CA02 DA08 EA12 EA14 FA01 FA15 GA47 GA48 GA49 GA50 MA17 MA28 NA04 NA10 PA26 5F045 BB10 BB14 DP19 DQ05 EB02 EB12 EE14 EM10 EN04 EN05

ENO6

FI HO1L 21/22 テーマコード(参考)

511Q

**PAT-NO:** JP02003007801A

**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 2003007801 A

TITLE: SUBSTRATE PROCESSING DEVICE

PUBN-DATE: January 10, 2003

### INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

TATENO, HIDETO N/A
YANAGAWA, HIDEHIRO N/A

### ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HITACHI KOKUSAI ELECTRIC INC N/A

**APPL-NO:** JP2001189380

APPL-DATE: June 22, 2001

INT-CL (IPC): H01L021/68 , B65G049/00 ,

B65G049/07 , C23C016/44 , H01L021/205 , H01L021/22

# ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent failure at releasing a pod with a pod opener.

SOLUTION: A wafer delivery port 13 which delivers wafer 9 between a pod 10 and a boat 8 is provided with a pod opener 20 which opens/closes a wafer delivery opening 10b, with a door 10a of the

pod 10 attached/detached. A chamber 60 which covers a wafer take-in/out opening 22 of a base 21 is installed at the base 21 of the pod opener 20. An air supply pipe 13 and an air discharge pipe 64 are connected to the chamber 60 for communication of nitrogen gas 62 with a closure housing room 61. At releasing of the pod, the closure housing room 61 of the chamber 60 is filled with the nitrogen gas 62, so that the air and water content in the closure housing room 61 and a wafer housing chamber 10c of the pod 10 are purged with the nitrogen gas 62. Since the atmosphere in the pod is prevented from being released into a wafer transportation space, the contamination of the transportation space, rising of oxygen concentration, oxydation of a wafer, and sticking of particles are prevented.

COPYRIGHT: (C) 2003, JPO